导电聚吡络对阴离子深度分布的XPS研究

郭可珍,李永舫,潘承璜,钱人元

中国科学院化学研究所

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 本文试图通过对X射线光电子能谱的电子起飞角依赖性的研究,

来得到导电聚吡咯的几十埃表面层内的阴离子浓度分布。

关键词 <u>X 射线光电子谱法 阴离子 溅射 离子浓度 酸根 聚吡咯 导电高聚物 硝酸 P</u>

分类号 0631.2

XPS study of depth distribution of anion in conducting polypyrrole

GUO KEZHEN,LI YONGFANG,PAN CHENGHUANG,QIAN RENYUAN

Abstract The depth distribution of NO3- in the thin layer of 50 ?thick below the surface of polypyrrole was studied on the basis of the dependence of XPS with electron flying angles. The anion concentration on the surface was much lower than that in the body.

Key wordsX-RAY PHOTOELECTRON SPECTROMETRYANIONSPUTTERINGION CONCENTRATIONACID RADICALPOLYPYRROLECONDUCTING POLYMERNITRIC ACID P

DOI:

通讯作者

扩展功能

本文信息

- ► Supporting info
- ▶ <u>PDF</u>(212KB)
- ▶[HTML全文](0KB)
- ▶参考文献

服务与反馈

- ▶把本文推荐给朋友
- ▶加入我的书架
- ▶加入引用管理器
- ▶复制索引
- ► Email Alert
- ▶文章反馈
- ▶浏览反馈信息

相关信息

- ▶ <u>本刊中 包含"X射线光电子谱法"</u> 的 相关文章
- ▶本文作者相关文章
- 郭可珍
- ・・・李永舫
- ・ 潘承璜
- 钱人元